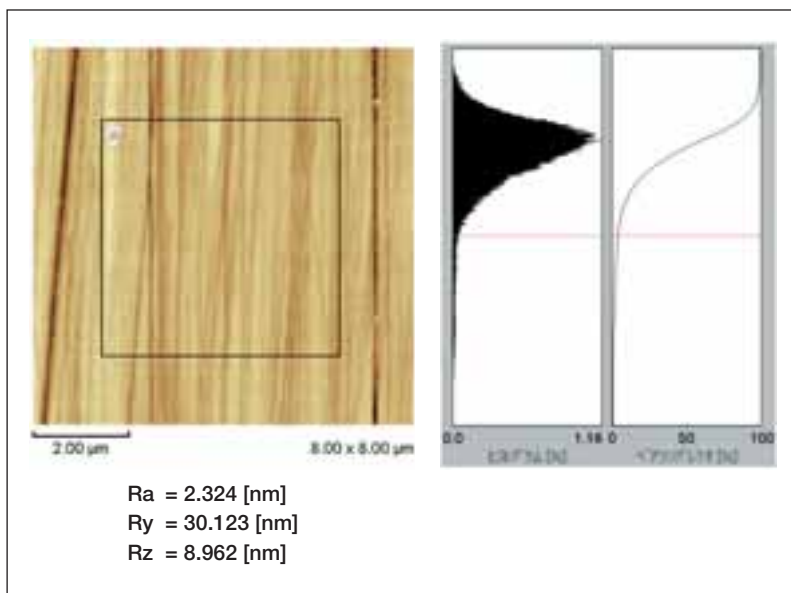


ディスク材料への応用例



これはハードディスク表面のテクスチャーと呼ばれる研磨痕です。SPM（走査型プローブ顕微鏡）により、大気中、無蒸着、非破壊で三次元形状が精密に観察できます。また、画像データをコンピューター処理できるため、観察像（左図 倍率約5000倍）に加えて、右図の様に表面粗さ、ヒストグラム、ベアリングレシオなどを算出することも簡単にできます。

テクスチャー、レーザーバンプ、ピット、膜厚、段差の測定など、ディスク、ウェーハの製造管理、プロセス開発用に従来までの触針式あらさ計や電子顕微鏡では得られないデータを提供します。

ディスク媒体の高密度化が進むにつれ、マイクロラフネス測定の強力なツールとして、SPMの有用性は今後ますます増加するものと思われます。